1D04

イオン液体/電解質水溶液界面の電気二重層構造の直接観察と評価

(東エ大・物質理工学院¹、京大院・エ²、ソガン大・物理³)

大橋光浩¹、岩橋崇¹、西直哉²、KIM Doseok³、O大内幸雄¹

Direct observation on the electric double layer structure of ionic liquid/electrolyte solution interfaces (Tokyo Tech.¹ · Kyoto Univ.² · Sogang Univ.³) M. Ohashi¹, T. Iwahashi¹, N. Nishi², D. Kim³, and Y. Ouchi¹

【緒言】イオン液体は有機カチオンおよびアニオンからなる常温・液体相の「塩」の総称 である。液体であるにも拘らず蒸気圧が極端に低いこと、カチオン・アニオンの適切な分子 設計により水・アルコールなどの極性溶媒に対して相溶性・非相溶性を示すことなど、既知 の分子液体とは著しく異なる物性を有するため、基礎・応用の両面から活発な研究が行われ ている。本講演ではイオン液体の電解質水溶液に対する非相溶性に着目し、当該界面におけ る電気二重層構造の直接観察と、その熱力学的評価を試みたので報告する。

【実験】イオン液体には高い疎水性を有する 1-methyl-3-octylimidazolium bis (pentafluoroethanesulfonyl)amide ([C₈mim][PFSA])¹⁾を、電解質水溶液には 1-methyl-3-octylimidazolium chloride ([C₈mim]Cl)水溶液を用いた。界面の直接観測には赤外-可視和周波発生振動分光法 (IV-SFG 法)を用いた²⁾。IV-SFG 法は可視光(ω_{vis})と赤外光(ω_{IR})を界面に入射した際に発生す る和周波光($\omega_{sf} = \omega_{vis} + \omega_{IR}$)を観測する手法であり、観測される和周波光の強度は以下の式 で表される。

$$I_{\rm sf}(\omega_{\rm IR}) \propto \left| \chi_{\rm NR} + \sum_q \frac{A_q}{\omega_{\rm IR} - \omega_q + i\Gamma_q} \right|^2, \quad A_q \propto N_{\rm s} \langle \beta_q \rangle \tag{1}$$

ここで χ_{NR} 、 ω_q 、 Γ_q はそれぞれ非線形感受率の非共鳴項、q番目の基準振動数、減衰定数であり、 A_q , N_s , $\langle \beta_q \rangle$ は振幅強度、界面

数密度、超分極率の配向平均を表す。 予め調整した[C₈mim]Cl 水溶液を外 部から注入し、液体セル内の水溶液 濃度を 0、0.01、0.1、0.5 M と変化さ せた際の IV-SFG スペクトル変化を 評価した。測定時の偏光組み合わせ は ppp(sf: p 偏光、vis: p 偏光、IR: p 偏光)および ssp を用いた。



図1 IV-SFG スペクトル: [C₈mim][PFSA]濃度依存性

【結果】図1に得られたスペクト ルを、表1に(1)式によるフィッティ

ング結果を示す。基準振動計算および IR、Raman スペクトルとの比較から、1149cm⁻¹のピー クを SO₂対称伸縮振動 (SO₂ss)、1109cm⁻¹を SNS 伸縮振動と帰属した。SO₂ss ピークは IR、 Raman に比して幅広であることから、H₂O 分子との水素結合による不均広がりと判断した。 【考察】[C₈mim]Cl 水溶液が高濃 度になるに従い SO₂ss ピーク強度は 減少するが、振幅強度比A_qssp/A_qppp は濃度によらず概ね一定であった。 これは電解質水溶液濃度が希薄で あれば、界面遷移層での[PFSA]⁻の 配向分布関数は概ね同一とみなせ

| Position Width | 1109.4cm ⁻¹ | | 1149.3cm ⁻¹ | |
|-------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|
| Conc. / M | /16.8 A ssp | A ppp | /26.6 A ssp | A ppp |
| 0.00 | -1.19 | -3.32 | 4.99 | 12.75 |
| 0.01 | -2.04 | -4.82 | 4.21 | 11.17 |
| 0.10 | -1.60 | -4.78 | 3.48 | 9.08 |
| 0.50 | -1.55 | -4.64 | 2.89 | 7.83 |

表1 IV-SFG スペクトルのフィッティング結果

ることを意味する。そこで(1)式から界面遷移層における[PFSA] $^-$ の界面数密度 $N_{\text{[PFSA]}}$ を評価し、ref.(1)から算出した電解質水溶液側の CI^- の界面過剰量 Γ_{CI} との相関を求めたところ、図 2 に示す通り、傾きがおよそ-0.77 となる直線関係を得た。この結果は

$$\frac{\mathrm{d}N_{\mathrm{[PFSA]}}}{\mathrm{d}\Gamma_{\mathrm{Cl}}} = -0.77 \quad (2)$$

を意味し、電解質水溶液側での濃度増加に伴 い*r*_{cl}が単位量増加すると、[PFSA]がイオン液体 側で-0.77 だけ減少することを表している。 IV-SFG 法から算出される表面数密度 *Ns* と表面 過剰量*r*と対比については、気体/液体表面にお いて盛んに議論されているところだが³³、本系の ような液体/液体界面においても有意の対応関係 が存在しうる事が分かった。



図2 界面過剰量 Γ_{Cl} と界面数密度 $N_{[PFSA]}$ の関係

そこで更に議論を進めるため、界面数密度 $N_{[PFSA]}$ と、 Γ_{CI} を介して熱力学モデルから算出される $\Gamma_{[PFSA]}$ との相関性を検討した。即ち、式(2) に対応する d Γ_{PFSAT} /d Γ_{CT} をモデル計算し、実

験結果との比較を試みた。熱力学モデルには 電解質水溶液側に Gouy-Chapman モデルを、イ オン液体側に Oldham モデル⁴⁾を採用し、イオ ン液体ならびに電解質水溶液には既知のパラ メータを用いた。結果を図 3 に示す。界面に おける CF の 特 異 吸 着 を 考 慮 し て も $d\Gamma_{[PFSAF}/d\Gamma_{CF}$ の値は検討した濃度範囲で大き く変動しており、(2)式のような線形関係を得 ていない。イオン液体の熱力学モデルには問



ていない。イオン液体の熱力学モデルには問 図3熱力学モデルから算出されるd *Г*_{IPFAF} /d *Г*_{cr}-題点も指摘されており、詳細については当日報告する。

【参考文献】1)T. Kakiuchi et al. *PCCP*, **6**(2004)4445. 2)T. Iwahashi et al. *PCCP*, 12(2010)12943. 3) J. Sung et al. *JPCB*, **109**(2005)18507, T. Ishihara et al. *JPCC*, **119**(2015)9879. 4) K, Oldham, *J.Electroanal.Chem.*, **613**(2008)131.